

電子顕微鏡で何ができるのか？

科学分析支援センター 徳永 誠

開催日：平成24年7月24日（火）

ご協力：株式会社日立ハイテクノロジーズ、ブルカー・エイエックスエス株式会社

出席：87名

内容：電子顕微鏡には、透過型(TEM)と走査型(SEM)の2種類がある。TEMは主として試料内部の微細構造に関する情報が得られ、SEMは主として試料表面の微細構造に関する情報が得られる。科学分析支援センターにはTEM 2台、SEM 4台が設置されており、X線元素分析装置(EDX)などの付属アタッチメントも充実している。今回のセミナーでは、これらの装置を教育・研究に、より有効活用していただくために、TEM、SEM装置及び付属アタッチメントであるEDXの原理と基礎の解説、並びに当センター所有の装置で測定可能なアプリケーションを中心とした実例を紹介して頂いた。

科学分析支援センター 機器分析セミナー

電子顕微鏡で何ができるのか？

科学分析支援センターには多くの電子顕微鏡(透過型(TEM) 2台、走査型(SEM) 4台)が設置されています。これらの装置を教育・研究に有効活用していただくために、装置の原理と基礎、アプリケーションを中心に、X線元素分析装置(EDX)の原理も含めたセミナーを開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日 時：2012年7月24日(火) 13:00 ～ 16:00

場 所：総合研究棟1階 シアター教室

資 料：TEMと友だちになろう、SEMと友だちになろう
(日立ハイテクノロジーズ編) 他

※ セミナー資料の準備の都合上、事前の参加申し込みをお願いいたします。

● プログラム

時間	講演内容	講演者
13:00 ～ 13:05	センター長挨拶	科学分析支援センター長 小林 秀彦
13:05 ～ 13:45	透過型電子顕微鏡の応用技術 ～TEMで何ができるのか？～ TEMの基礎とアプリケーションデータの紹介	㈱日立ハイテクノロジーズ 中澤 英子 氏
13:45 ～ 14:00	休憩	
14:00 ～ 14:40	走査型電子顕微鏡の応用技術 ～SEMで何ができるのか？～ SEMの基礎とアプリケーションデータの紹介	㈱日立ハイテクノロジーズ 中澤 英子 氏
14:40 ～ 15:00	休憩	
15:00 ～ 15:40	X線元素分析装置の応用技術 ～EDXで何ができるのか？～ EDXの基礎とアプリケーションデータの紹介	ブルカー・エイエックスエス㈱ 山崎 巖 氏
15:40 ～ 16:00	質疑応答	

※ セミナー開催の記録のために、写真を撮影させていただきます。
撮影した写真は、必要に応じて報告書等に掲載し公開されることがありますので、予めご承知をお願いします。

セミナーの申し込み & 問い合わせ：

科学分析支援センター（内）5102・徳永 誠 (toku@mail.saitama-u.ac.jp)